

"RIFRATTOMETRO A SFERA DIELETTRICA"



Antonio Parretta* e Linda Polastri**

*parretta@fe.infn.it **linda.polastri@student.unife.it

Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra Università di Ferrara

RIASSUNTO

- Una <u>sfera dielettrica</u> omogenea può essere assimilata, entro certe condizioni operative, ad una <u>lente spessa</u>.
- In questo lavoro sono analizzate le <u>proprietà di focalizzazione</u> di una <u>sfera dielettrica</u> <u>solida o liquida</u> contenuta in una sfera trasparente a parete sottile.
- Lo scopo è realizzare un <u>semplice rifrattometro</u> ("Rifrattometro a sfera dielettrica").
- Sono stati applicati <u>due metodi analitici</u> (il metodo trigonometrico e il metodo delle lenti spesse) e un programma di simulazione a <u>tracciamento di raggi</u>, sotto l'ipotesi di ottica parassiale.



SOMMARIO

- Proprietà ottiche della sfera dielettrica
- Geometria del fascio trasmesso
- Analisi di sfere dielettriche solide
- Analisi di sfere dielettriche liquide
- Strumentazione e metodi di misura
- Risultati
- Conclusioni



Eliofanografo

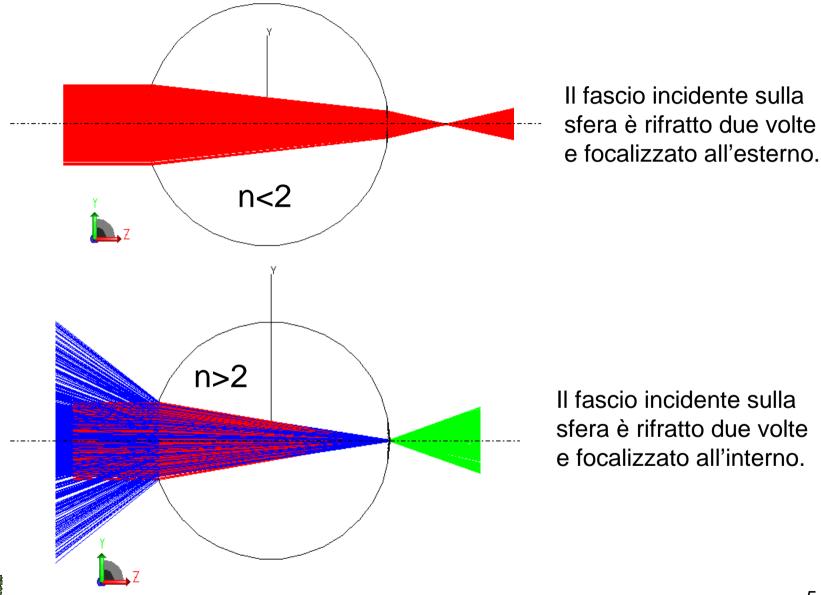




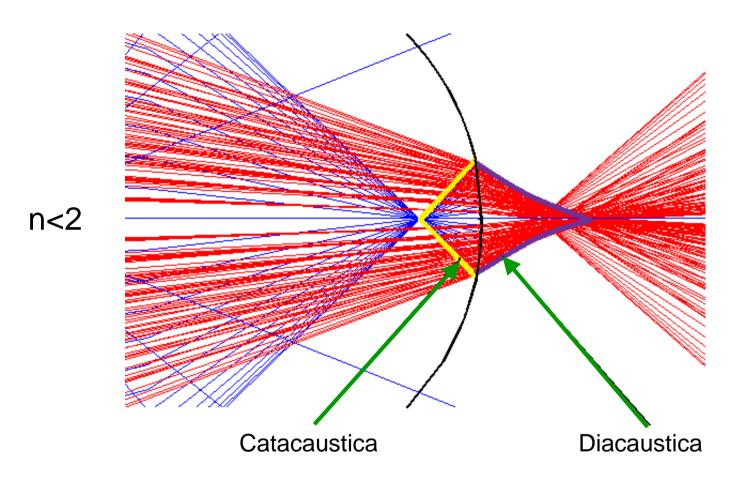
Eliofanografo di Campbell (1853) e Stokes (1880):

Apparecchio per la misurazione delle ore di luce e dell'intensità della radiazione solare (insolazione). E' costituito da una sfera di vetro ottico sostenuta ai poli da due supporti situati all'estremità di un arco meridiano graduato, il quale consente di disporre l'asse della sfera con una inclinazione in gradi rispetto all'orizzontale, uguale ai gradi di latitudine del luogo. I raggi solari, attraversando la sfera di cristallo pieno, lasciano tracce di bruciato su una striscia di carta posta sulla semisfera sottostante.

Proprietà ottiche della sfera dielettrica

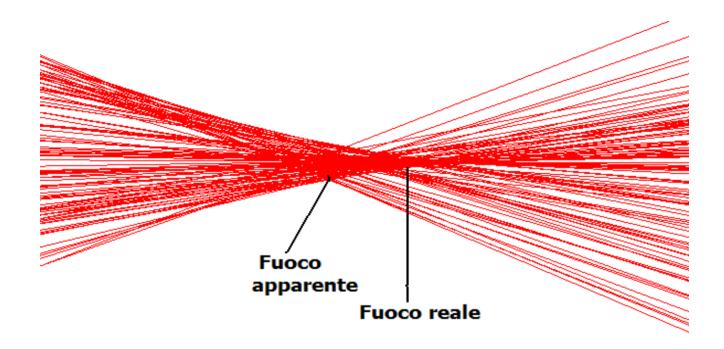


Proprietà ottiche della sfera dielettrica



La <u>catacaustica</u> risulta dall'inviluppo dei raggi riflessi all'interno della sfera La <u>diacaustica</u> risulta dall'inviluppo dei raggi trasmessi all'esterno della sfera

Geometria del fascio vicino al fuoco

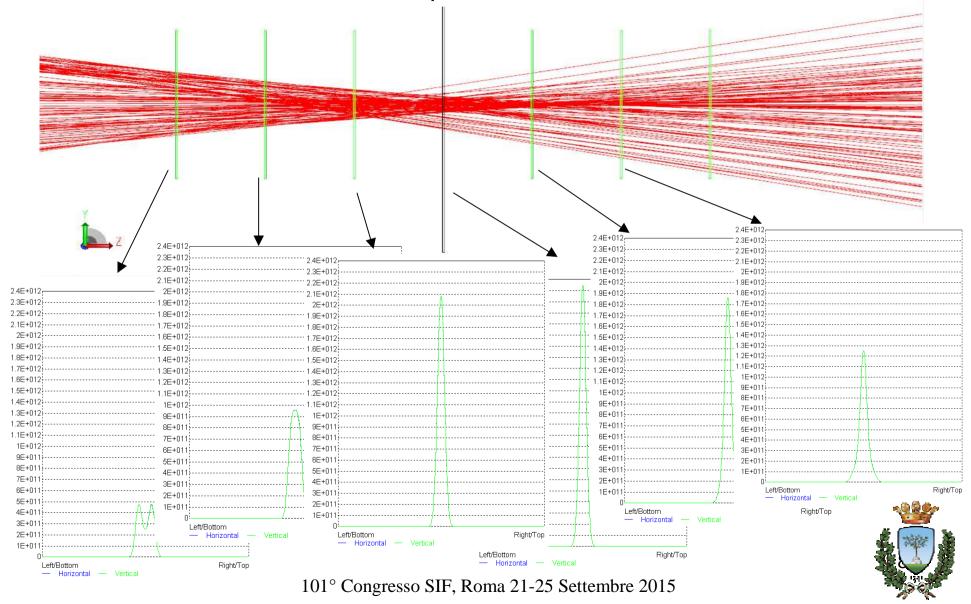


Fuoco apparente: risulta dall'inviluppo di tutti i raggi trasmessi. E' il punto nel quale il fascio mostra una strozzatura. Vi concorre l'aberrazione sferica.

Fuoco reale: è formato dai raggi parassiali. In figura appare dopo la strozzatura e quindi è il fuoco più lontano dalla sfera.



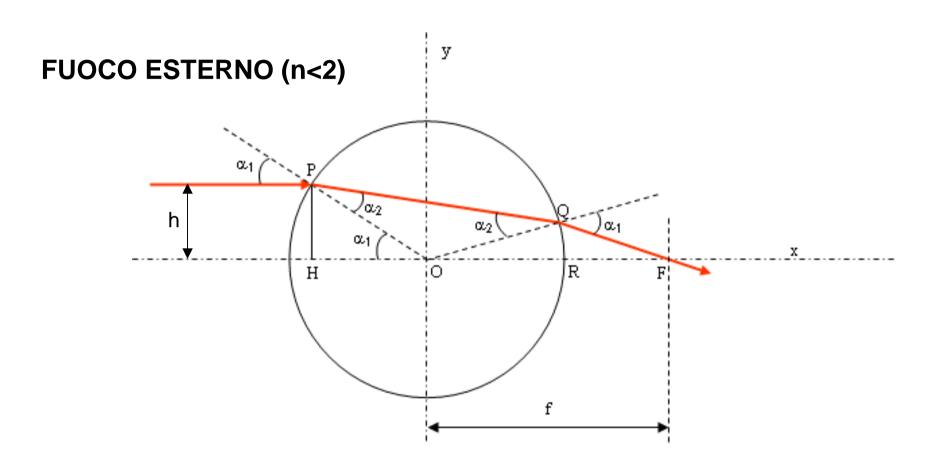
Attraverso simulazioni con il programma TracePro®, il fascio viene caratterizzato interponendo uno schermo assorbente perpendicolare all'asse ottico e analizzando il picco d'irradianza.



Metodo trigonometrico



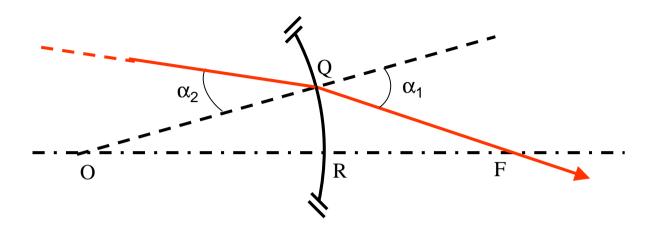
Sfere dielettriche solide



Applicando la trigonometria e la legge di Snell, si ricava un'equazione generale per la lunghezza focale normalizzata:

$$\frac{f}{R} = f\left(\frac{h}{R}, n\right)$$

Risolvendo il triangolo OQF si trova:



$$\frac{f}{R}\left(\frac{h}{R},n\right) = \frac{\cos(2\alpha_2 - \alpha_1) - \cos\alpha_1 \cdot \cos(2\alpha_1 - 2\alpha_2)}{\sec^2(2\alpha_1 - 2\alpha_2)}$$

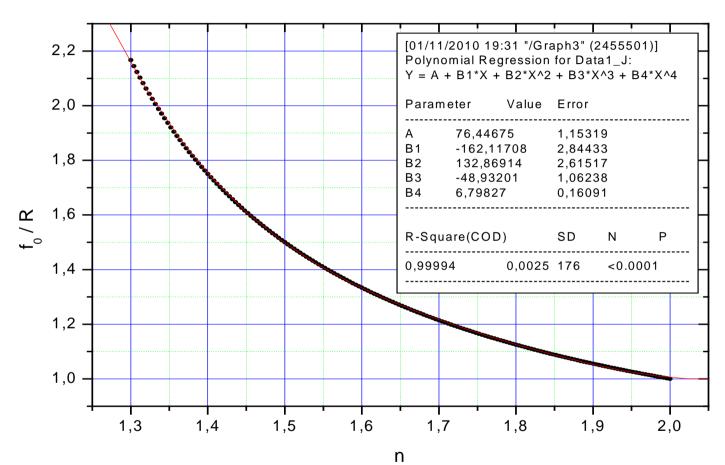
Dove:
$$\alpha_1 = sen^{-1} \left(\frac{h}{R} \right)$$
 $\alpha_2 = sen^{-1} \left(\frac{h}{nR} \right)$

Graficando tale equazione con il programma Origin si ottiene un grafico generale valido per ogni materiale solido ed omogeneo ...



Focale <u>parassiale</u> in funzione dell'indice di rifrazione per fuoco esterno (n<2)

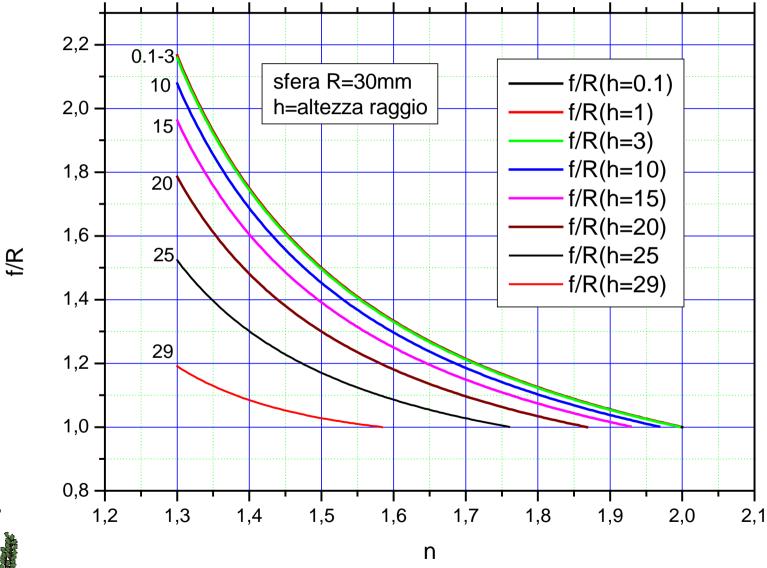
Per h/R \rightarrow 0 si ottiene:



Fit dei dati con un polinomio del 4° grado:

 $\frac{f_0}{R}(n) = 76.44675 - 162.11708 * n + 132.86914 * n^2 - 48.93201 * n^3 + 6.79827 * n^4$

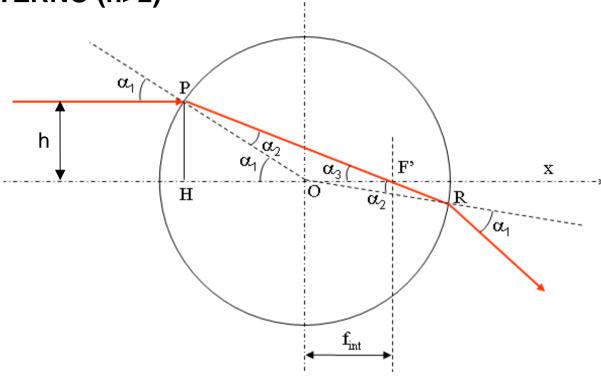
Differenti aperture del diaframma, h





Sfere dielettriche solide

FUOCO INTERNO (n>2)



Applicando la trigonometria e la legge di Snell, si ricava un'equazione generale per la lunghezza focale normalizzata:

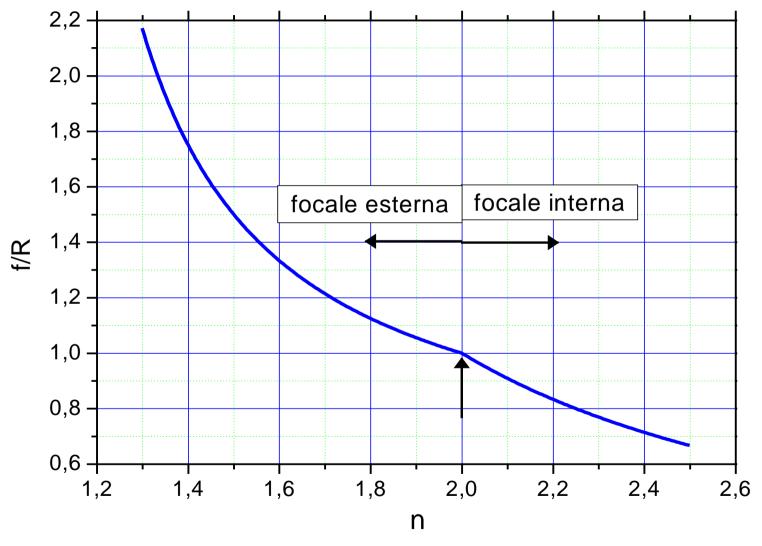


$$\frac{f_{\text{int}}}{R} = f_{\text{int}} \left(\frac{h}{R}, n \right) = \frac{\sin \alpha_1}{\tan \alpha_3} - \cos \alpha_1 \begin{vmatrix} \alpha_3 = \alpha_1 - \alpha_2 \\ \alpha_1 = \sin^{-1}(h/R); & \alpha_2 = \sin^{-1}(h/nR) \end{vmatrix}$$

$$\alpha_3 = \alpha_1 - \alpha_2$$

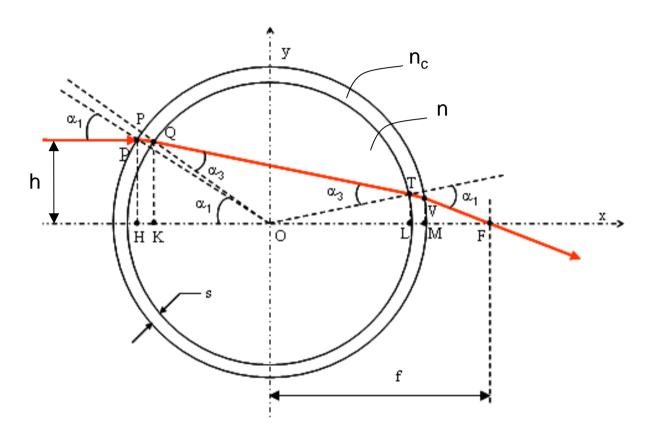
$$\alpha_1 = \sin^{-1}(h/R); \ \alpha_2 = \sin^{-1}(h/nR)$$

Confronto tra focale parassiale interna ed esterna





Sfere dielettriche liquide



Applicando la trigonometria e la legge di Snell, si ricava un'equazione generale per la lunghezza focale normalizzata:



$$\frac{f}{R} = f(R, h, s, n_c, n)$$

Si considerino i triangoli OHP e OHQ:

$$\alpha_1 = \sin^{-1} \left(\frac{h}{R+s} \right) \qquad \alpha_2 = \sin^{-1} \left(\frac{\sin \alpha_1}{n_c} \right)$$

$$\alpha_3 = \sin^{-1} \left(\sin \alpha_2 \frac{n_c}{n} \right) \qquad \Delta \alpha = \cos^{-1} \left(\frac{OK}{R} \right) - \alpha_1$$

Si considerino i triangoli OVM e MVF:

$$MF = \frac{VM}{tg(M\hat{V}F)}$$

$$OM = OV \cdot \cos(\beta - \Delta\beta) = (R + s) \cdot \cos(\beta - \Delta\beta)$$

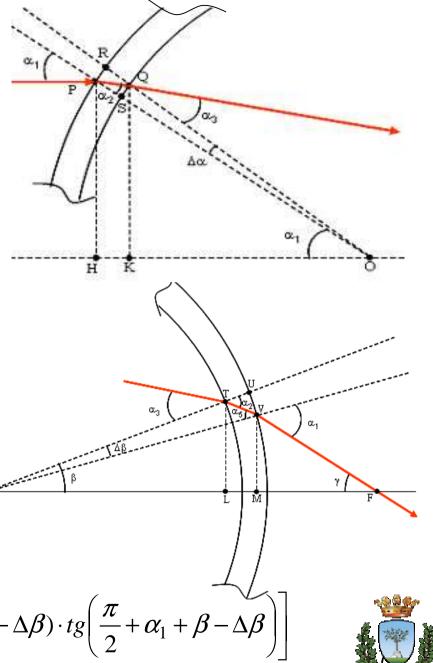
$$\mathbf{M}\hat{\mathbf{V}}\mathbf{F} = \boldsymbol{\pi} - \left(\frac{\boldsymbol{\pi}}{2} - \boldsymbol{\beta} + \Delta \boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{\alpha}_1\right) = \frac{\boldsymbol{\pi}}{2} + \boldsymbol{\beta} - \Delta \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\alpha}_1$$

$$VM = (R + s) \cdot \sin(\beta - \Delta \beta)$$

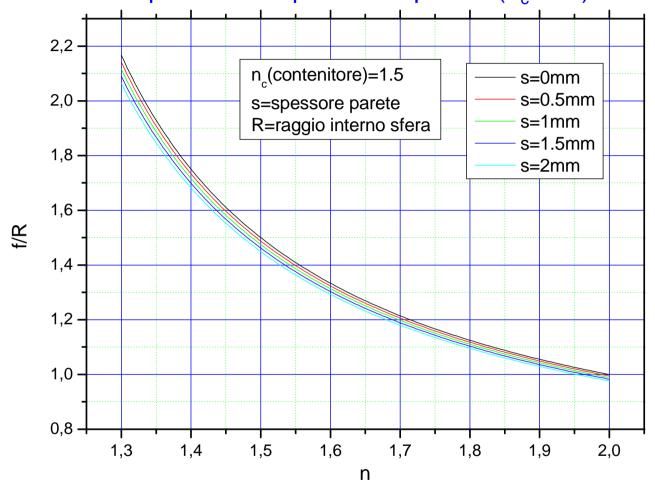
$$\beta = \pi - \alpha_1 - \Delta \alpha - (\pi - 2\alpha_3) = 2\alpha_3 - \alpha_1 - \Delta \alpha$$

$$\Delta \beta = \cos^{-1} \left[\frac{2(R^2 + Rs) \cdot \cos^2 \alpha_2 - s^2 \cdot \sin^2 \alpha_2}{2R(R+s) \cdot \cos^2 \alpha_2} \right]$$

$$f = OM + MF = (R + s) \cdot \left[\cos(\beta - \Delta \beta) + sen(\beta - \Delta \beta) \cdot tg \left(\frac{\pi}{2} + \alpha_1 + \beta - \Delta \beta \right) \right]$$



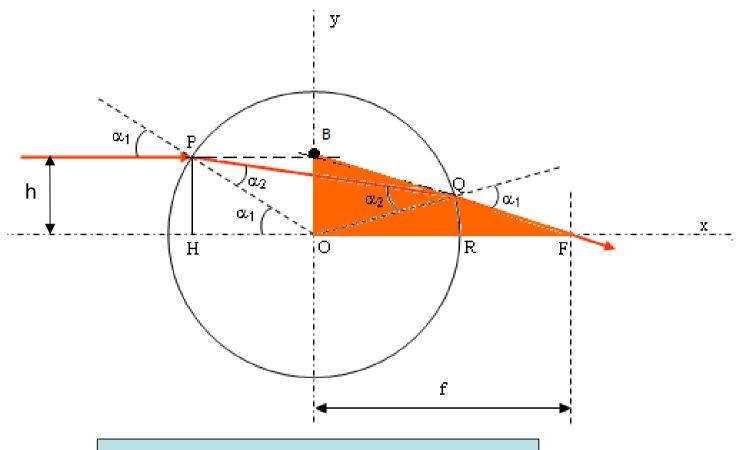
Focale parassiale relativa in funzione dell'indice di rifrazione per diversi spessori di parete (n_c=1.5)



$$\left| \frac{f}{R} = f(R, h, s, n_c, n) = \frac{(R+s)}{R} \cdot \left[\cos(\beta - \Delta \beta) + sen(\beta - \Delta \beta) \cdot tg \left(\frac{\pi}{2} + \alpha_1 + \beta - \Delta \beta \right) \right] \right|$$

Metodo delle lenti spesse





$$\frac{f}{R} = f\left(\frac{h}{R}, n\right) = \frac{h}{R} \cdot \frac{1}{\tan[2 \cdot (\alpha_1 - \alpha_2)]} \qquad \alpha_1 = \sin^{-1}(h/R)$$

$$\alpha_2 = \sin^{-1}(h/nR)$$

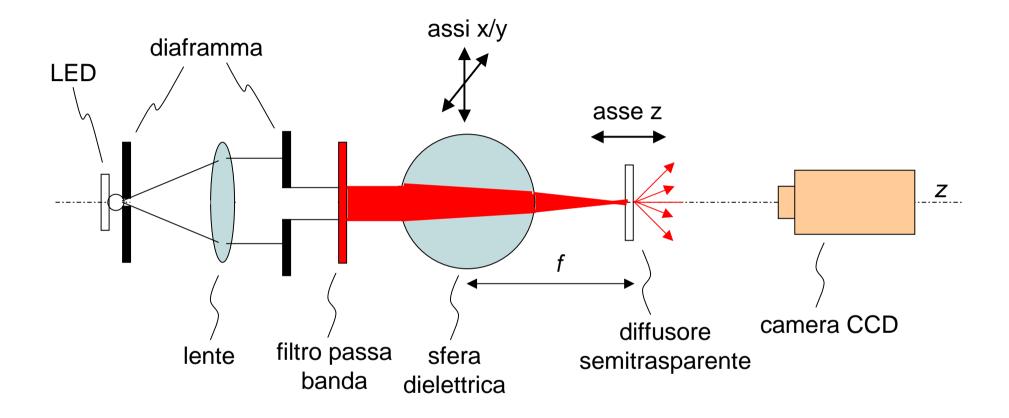
$$\alpha_1 = \sin^{-1}(h/R)$$

$$\alpha_2 = \sin^{-1}(h/nR)$$



Il metodo trigonometrico e quello delle lenti spesse danno gli stessi risultati per raggi parassiali

Schema di principio del rifrattometro



La lunghezza focale f si misura movimentando il diffusore con un motorino passo-passo, registrando con la CCD l'immagine prodotta e analizzandola al PC.

Schema dell'apparato sperimentale

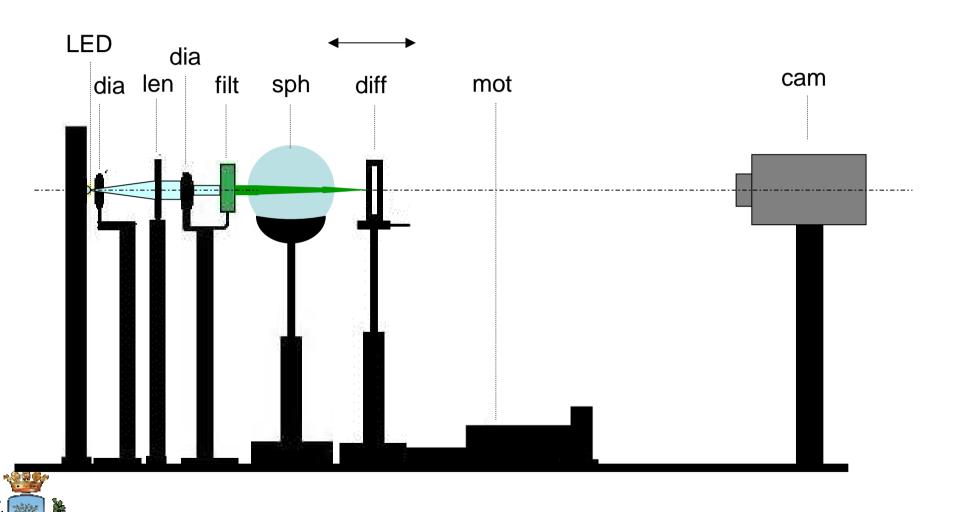
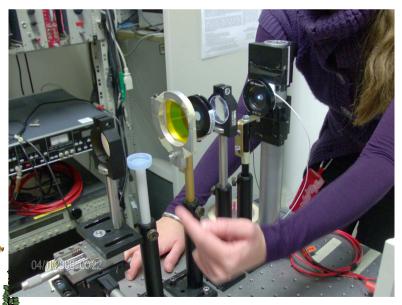
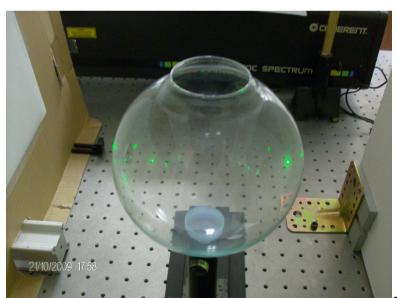


Foto dell'apparato sperimentale









Metodo di misura del fuoco

Strumenti:

- Schermo diffusore semitrasparente;
- Motorino per lo spostamento fine dello schermo e micrometro;
- Camera CCD;
- Programma per PC.

Procedura:

- * Scattate 10 fotografie dell'immagine sullo schermo per ogni sua posizione.
- Analisi delle foto con un programma che conta i pixel illuminati ("dead pixel text"): minore è il numero di pixel illuminati e più l'immagine analizzata si trova vicino al fuoco.
- L'immagine con il minor numero di pixel illuminati corrisponde al fuoco.
- Per evitare il conteggio di dead pixels della CCD, ogni 10 misurazioni si fa una foto con la CCD oscurata.



Sfere analizzate

Sfere solide:

- Acrilico
- Policarbonato

Sfere in vetro riempite con:

- Acqua distillata
- Glicerina

Lunghezze d'onda

 $\lambda = 450 / 500 / 550 / 600 / 650$ nm;

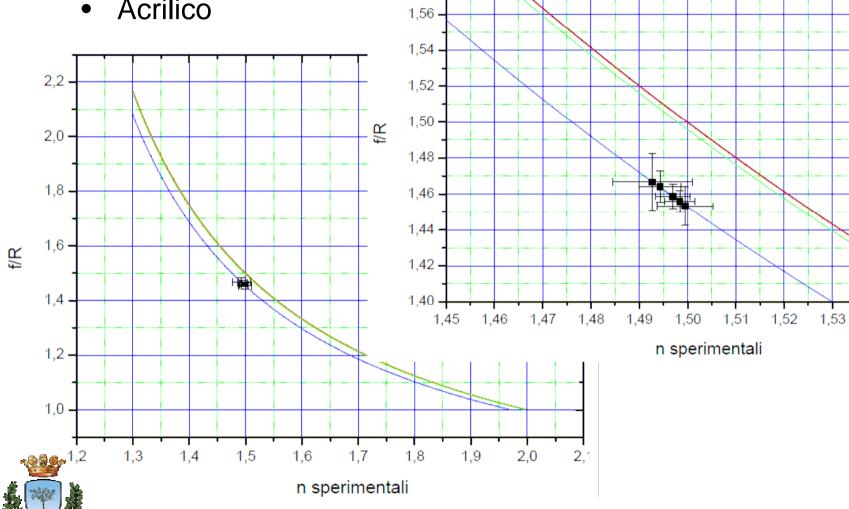


Dati sperimentali

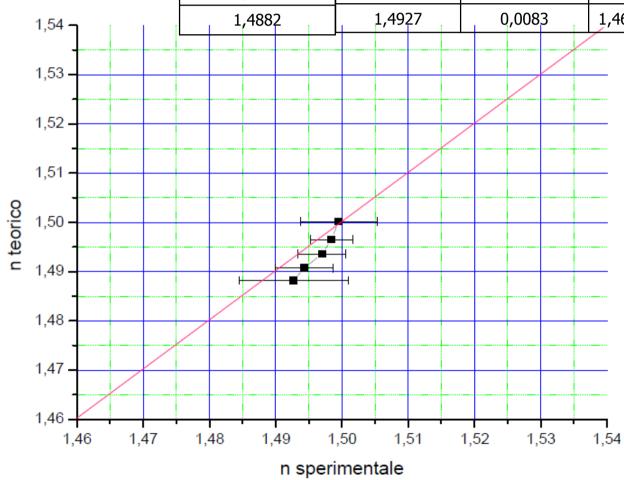
1,58

SFERE SOLIDE:

Acrilico



n teorico acrilico	n sperimentale acrilico	∆n sperimentale	$\frac{f}{R}$	$\Delta \left(\frac{f}{R}\right)$	Lunghezza d'onda (nm)
1,5002	1,4995	0,0058	1,4533	0,0108	450
1,4965	1,4984	0,0032	1,4560	0,0060	500
1,4936	1,4970	0,0036	1,4587	0,0067	550
1,4907	1,4943	0,0044	1,4640	0,0086	600
1,4882	1,4927	0,0083	1,4667	0,0158	650



Acrilico

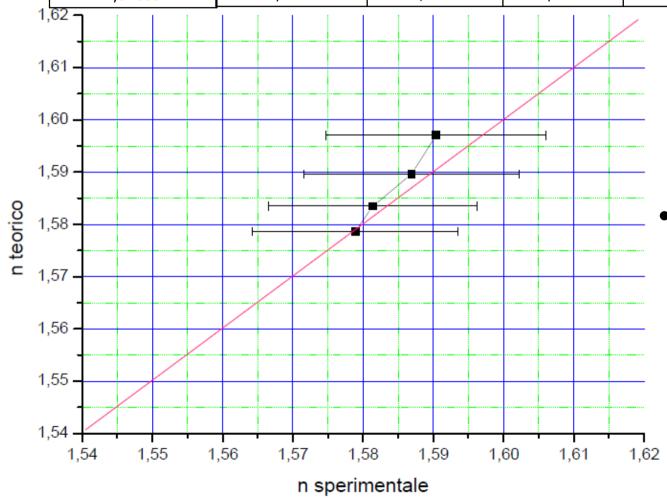


101° Congresso SIF, Roma 21-25 Settembre 2015

1,60 **SFERE SOLIDE:** 1,55 Policarbonato 1,50 1,45 -2,2 -1,40 f/R 2,0 -1,35 -1,30 1,8 -1,25 -1,6 f/R 1,20 1,58 1,60 1,62 1,56 1,50 1,52 1,54 1,64 1,66 n sperimentali 1,4 -1,2 -1,0 -1,7 1,3 1,5 1,6 1,2 1,4 1,8 1,9 2,0 n sperimentali

101° Congresso SIF, Roma 21-25 Settembre 2015

n sperimentale policarbonato	∆n sperimentale policarbonato	$\frac{f}{R}$	$\Delta \left(\frac{f}{R}\right)$	Lunghezza d'onda (nm)
1,5904	0,0157	1,3096	0,0271	500
1,5869	0,0153	1,3128	0,0259	550
1,5814	0,0148	1,3223	0,0204	600
1,5789	0,0146	1,3254	0,0164	650
	1,5904 1,5869 1,5814	policarbonato sperimentale policarbonato 1,5904 0,0157 1,5869 0,0153 1,5814 0,0148	policarbonatosperimentale policarbonato $\frac{J}{R}$ 1,59040,01571,30961,58690,01531,31281,58140,01481,3223	policarbonato sperimentale policarbonato $\frac{J}{R}$ $\frac{J}{R}$ 1,5904 0,0157 1,3096 0,0271 1,5869 0,0153 1,3128 0,0259 1,5814 0,0148 1,3223 0,0204

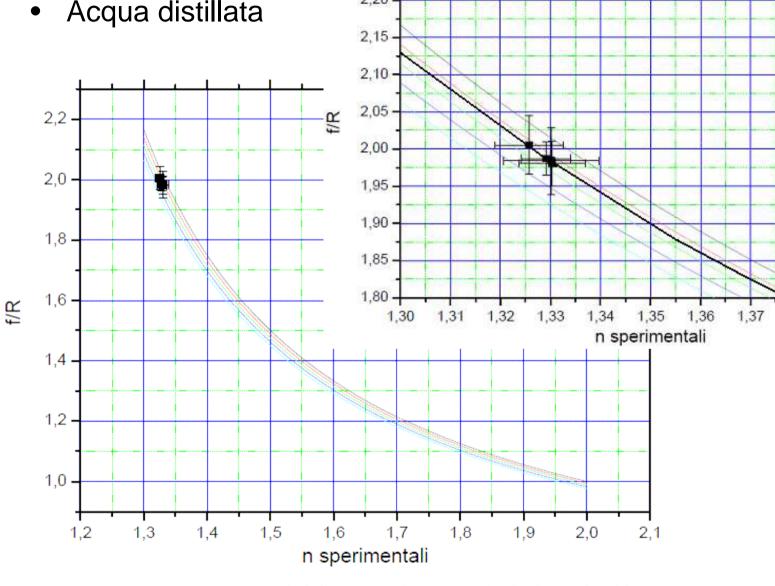


Policarbonato



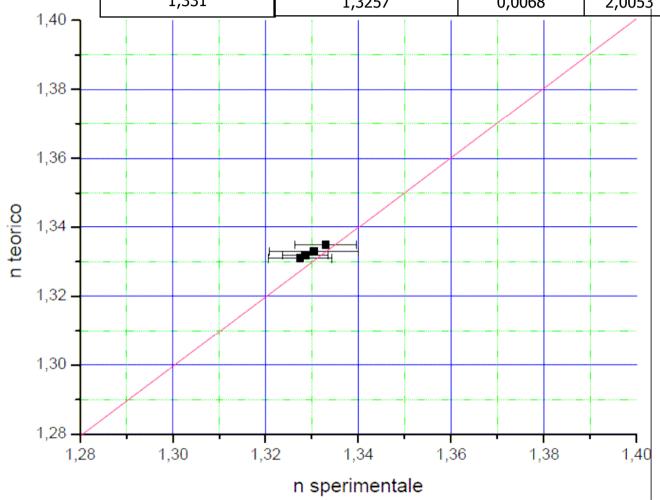
101° Congresso SIF, Roma 21-25 Settembre 2015

2,30 -**SFERE CON LIQUIDO:** 2,25 2,20 Acqua distillata 2,15 2,10 2,05 2,2 . 2,00 2,0 -1,95 1,90 1,8 -1,85 -



1,38

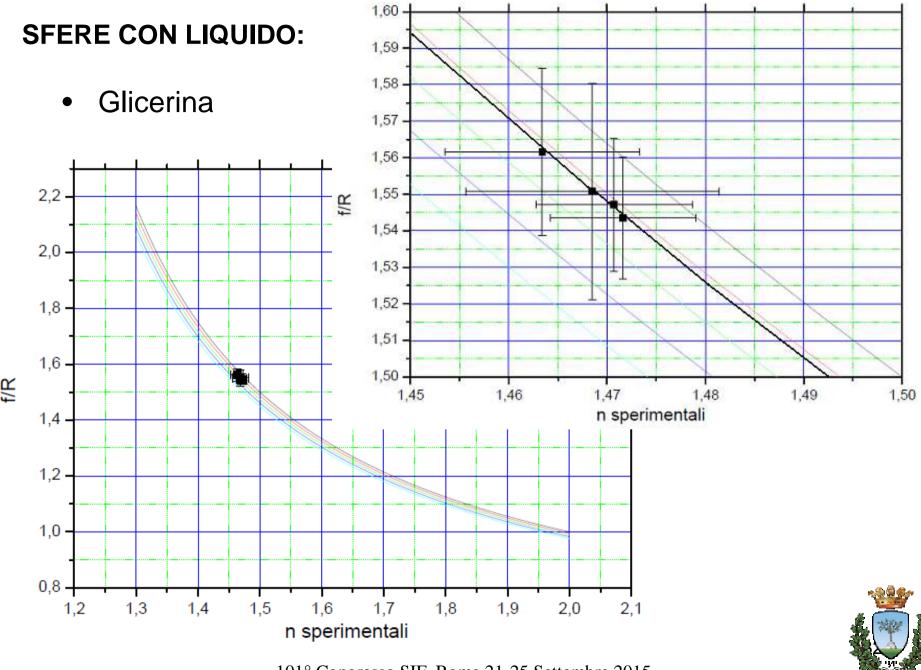
n teorico acqua distillata	n sperimentale acqua distillata	Δn sperimentale	$\frac{f}{R}$	$\Delta \left(\frac{f}{R} \right)$	Lunghezza d'onda (nm)
1,335	1,3303	0,0066	1,9809	0,0303	500
1,333	1,3301	0,0096	1,9840	0,0453	550
1,332	1,3291	0,0049	1,9870	0,0223	600
1,331	1,3257	0,0068	2,0053	0,0398	650



Acqua distillata

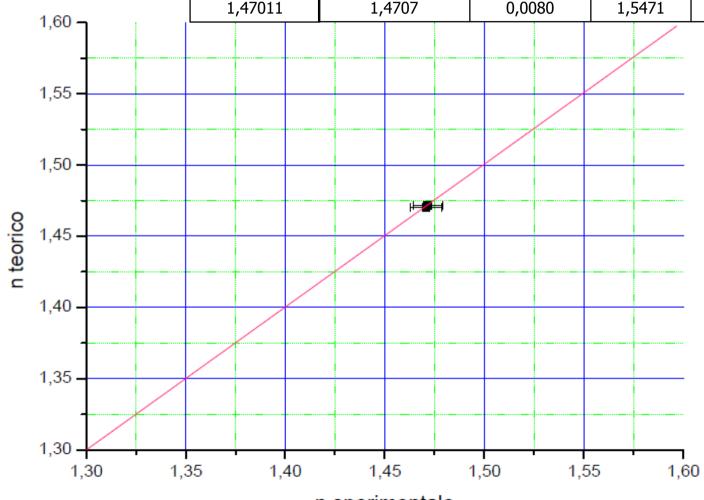


101° Congresso SIF, Roma 21-25 Settembre 2015



101° Congresso SIF, Roma 21-25 Settembre 2015

n teorico glicerina	n sperimentale glicerina	∆n sperimentale	$\frac{f}{R}$	$\Delta \left(\frac{f}{R} \right)$	Lunghezza d'onda (nm)
Sconosciuto	1,4634	0,0099	1,5616	0,0228	500
Sconosciuto	1,4685	0,0129	1,5507	0,0296	550
1,4718	1,4716	0,0074	1,5435	0,0168	600
1,47011	1,4707	0,0080	1,5471	0,0182	650



n sperimentale

101° Congresso SIF, Roma 21-25 Settembre 2015



Glicerina

Conclusioni

- Il metodo di misura proposto è valido in quanto fornisce valori di indice di rifrazione concordi con quelli teorici tabulati.
- Lo strumento è in grado di misurare "n" per la maggior parte dei liquidi e solidi dielettrici con n<2.
- La strumentazione è relativamente semplice.
- La modalità di raccolta dati è laboriosa, ma fornisce risultati molto accurati.
- Il metodo è più adatto per misure su liquidi.
- Il rifrattometro è uno strumento da banco ottico, poco pratico per una utilizzazione di routine, ma utile per la didattica. Esso va migliorato (parallelismo fascio, uso di recipienti omogenei, allineamento dei vari componenti, programma automatico per l'analisi delle immagini).

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Unifestival. Dal 25 al 27 settembre l'Università di Ferrara scende in piazza



Riferimento:

L. Polastri: "Misura dell'indice di rifrazione di materiali solidi o liquidi col metodo della sfera dielettrica".

Tesi di Laurea in Fisica, A.A. 2009-10, Università di Ferrara.

